## Работа 3.3.1

# Определение удельного заряда электрона методами магнитной фокусировки и магнетрона

Подлесный Артём группа 827

5 декабря 2019 г.

Цель работы: исследование свободных колебаний в контуре.

# Краткая теоретическая справка.

Для колебательного контура с включенным в него сопротивлением можно написать уравнение:

 $RI + U_c = -L\frac{dI}{dt}.$ 

Если продифференцировать его во времени и принять следующие обозначения:  $\gamma=\frac{R}{2L},~\omega_0^2=\frac{1}{CL},$  то это уравнение принимает вид:

$$\ddot{I} + 2\gamma \dot{I} + \omega_0^2 I = 0. \tag{1}$$

В данном случае нас интересует случай, когда  $\gamma \ll \omega_0$ , тогда решая (1) получаем:

$$I = -\frac{U_0}{L\omega}e^{-\gamma t}\sin\omega t,\tag{2}$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

Тогда в нашем случае:

$$T = 2\pi\sqrt{LC},\tag{3}$$

а временная зависимость напряжения:

$$U_C = U_0 \exp^{-\gamma t} \cos \omega_0 t.$$

При  $\gamma = \omega_0$  происходит переход в апериодический режим, чему соответствует критическое сопротивление:

$$R_{\rm Kp} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. (4)$$

Введем добротность:

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W},$$

которая характеризует потери энергии W в затухающих колебаниях, наряду с декрементом затухания:

$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_k}{U_{k+n}},\tag{5}$$

где  $U_k$  – амплитуда k-того колебания. Если выразить добротность через параметры установки, получаем:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\pi}{\Theta}.$$
 (6)

# Экспериментальная установка

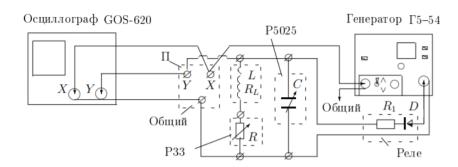


Рис. 1: Экспериментальная установка для исследования свободных колебаний.

После сборки схемы можно приступать к снятию экспериментальных данных.

## Экспериментальные данные

В работе было необходимо снять зависимости для измерения зависимости периода контура от емкости конденсатора, критическое сопротивление при котором колебательный режим переходит в апериодический, а так же исследовать затухающие колебания контура на фазовой плоскости. Далее о каждом из пунктов подробнее.

#### Измерение периодов

В данном случае сопротивление R на магазине сопротиления выставляли равным 0. Для расчета периода в зависимости от емкости: T(C), на осциллографе, зная масштабирование оси x по времени:  $\Delta$ , измерялась ширина, занимаемая некоторым целым числом полных периодов колебаний (что видно на осциллографе), на основании чего рассчитывался период по следующей формуле:

$$T = \frac{x\Delta}{n}. (7)$$

Результаты представлены на таблице 1.

$C$ , мк $\Phi$	$\Delta$ , мс/см	$\mid n \mid$	x, cm	$\mid T$ , мс $\mid$
0.02	0.2	3	5	0.33
0.11	0.5	3	5.6	0.93
0.2	0.5	3	6.4	1.07
0.29	0.5	3	7.8	1.30
0.38	1	5	7.4	1.48
0.47	1	4	6.6	1.65
0.56	1	4	7.2	1.80
0.65	1	4	7.8	1.95
0.74	1	3	6.2	2.07
0.83	1	3	6.6	2.20
0.9	1	3	6.8	2.27

Таблица 1: Зависимость периода электрических колебаний T от емкости конденсатора C в контуре.

#### Критическое сопротивление и декремент затухания

Приняв  $L=200~{\rm M}\Gamma$ н, можно найти емкость конденсатора, которая нужна для того, чтобы частота собственных колебаний была равна  $\nu_0=5~{\rm k}\Gamma$ ц по следущей формуле:

$$C = (4\pi^2 \nu_0^2 L)^{-1} = 0.005 \text{ MK}\Phi,$$

откуда по формуле (4):

$$R_{\mathrm{Kp}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \approx 13 \text{ KOm.}$$
 (8)

Плавно изменяя сопротивление, можно поймать момент, когда колебания становятся апериодичными. Исходя из этого "подбора"получаем такое сопротивление:

$$R_{\rm kp} = 9500 \; {\rm Om}.$$

Оно сильно отличается, однако это только потому, что индуктивность не совпадает с реальным значением.

Найдем зависимость декремента затухания в зависимости от сопротивления магазина, в области  $0.1R_{\rm kp} \div 0.3R_{\rm kp}$ , при известной емкости. Декремент затухания считается по формуле (5). Эта зависимость представлена на таблице 2.

$R/R_{ m Kp}$	R, Om	$\mid n \mid$	$U_k$ , cm	$U_{k+n}$ , cm	Θ
0.1	950	2	5.6	1.6	0.626
0.13	1235	2	4.7	1	0.774
0.16	1520	2	4	0.6	0.949
0.19	1805	2	3.3	0.4	1.055
0.22	2090	2	6.8	0.5	1.305
0.25	2375	1	5.7	1.2	1.558
0.28	2660	1	4.8	0.8	1.792
0.3	2850	1	4.2	0.6	1.946

Таблица 2: Зависимость декремента затухания колебаний  $\Theta$  от сопротивления R, установленного на магазине сопротивлений.

#### Колебания на фазовой плоскости

С помощью осциллографа были проведены наблюдения колебаний на фазовой плоскости, для 2 значений R в близи нижней и высшей границ измерения декремента затухания цепи. Эти картины представлены на рис. 2.

Отсюда отношение амплитуд можно определить по отношению расстояний пересчений витков с осями, что соответствует амплитудам колебаний, разделенными целым числом периодов. Благодаря цифровой картине, можно существенно повысить точность измерения этих аплитуд, тк можно игнорировать цену деления осциллографа.

Оммическое сопротивление катушки и её индуктивность измерялись с помощью LCR-измерителя на переменном токе. Данные представлены на таблице 3.

$f$ , $\Gamma$ ц	50	1000	5000
$R_L$ , Om	10.2	12.6	20.1
$L$ , м $\Gamma$ н	150.2	144.4	145.4

Таблица 3: Результаты измерений LCR. Как видно, при изменении частоты, меняется и оммическое сопротивление. Это связано с тем, что при измерении в контуре возникают вынужденные колебания, и импеданс колебаний зависит от частоты генератора.

## Обработка экспериментальных данных.

# Соответствие теоретических и экспериментальных периодов колебаний контура

Так как частота контура лежит в диапазоне  $1000 \div 5000~\Gamma$ ц, то возьмем следующее значение для индуктивности катушки:  $L=145~\mathrm{m}\Gamma$ н. Тогда по формуле получаем зависимость  $T_{\mathrm{эксп}}(T_{\mathrm{теор}})$ , представленная на рис. 3.

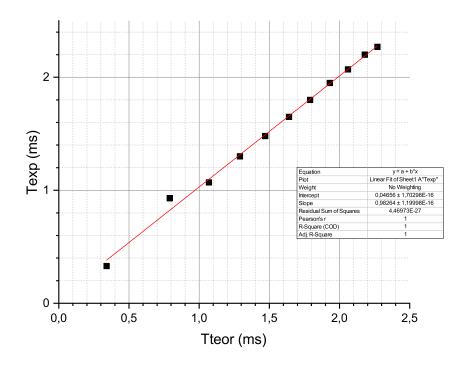


Рис. 2: График зависимости  $T_{\text{эксп}}(T_{\text{теор}})$ . На графике видно, что только 1 точка не ложится на прямую, имеющую коэффициент наклона крайне близкий к еденице. Эта точка скорее всего является результатом неправильной интерпретации картинки на осциллографе.

Этот график позволяет утверждать, что осциллограф крайне точно передает картину колебаний, легкое несоответствие результатов вызвано лишь несовершенством установки.

# Расчет критического сопротивления через декремент затухания

Формула для расчета критического сопротивления:

$$R_{\rm Kp} = 2\pi\sqrt{\alpha},\tag{9}$$

где  $\alpha$  — коэффициент наклона графика следующей зависимости:  $1/\Theta^2=f(1/R_{\text{конт}})$ , где  $R_{\text{конт}}=R+R_L$ . Этот график показан на рис. 4. Для данной емкости частота соответствует 5900 Гц, поэтому  $R_L=20\pm 2$  Ом,  $L=145.4\pm 9.0$  мГн.

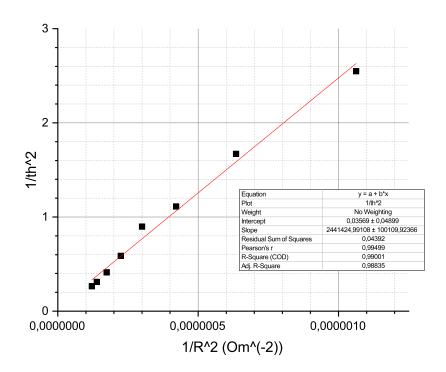


Рис. 3: График зависимости  $1/\Theta^2 = f(1/R_{\text{конт}})$ . Точки на графике не слишком хорошо ложатся на прямую, и, скорее всего, это из-за того, что значение  $R_L$  было измерено при другой частоте, чем частота контура в этом эксперименте.

Получаем значение коэффициента наклона этого графика:

$$\alpha = (2.44 \pm 0.10) \times 10^6 \text{ Om}^2,$$

откуда:

$$R_{\rm kp} = 9.8 \pm 0.4 \; {\rm kOm}.$$

Как видно, этот результат согласуется с определенным качественно по картине колебаний на осциллографе. Теоретически посчитаем критическое сопротивление по формуле (2):

$$R_{\rm Kp_{\rm reop}} = 10.8 \pm 0.7 \; {\rm kOm}.$$

С учетом погрешности результаты согласуются, хотя точность оставляет желать лучшего.

#### Расчет добротности контура

Расчет добротности проводился для максимального и минимального сопротивлений резистора: 0.1 и 0.3 от критического сопротивления. По формуле (6) можем рассчитать добротности по данным установки и по декременту затухания. Они будут представлены в секции "Результаты". Так же использовался метод расчета добротности по спиралям на фазовой плоскости. Для этого с помощью k-радиусов спирали отсчитывались декремент затухания, а из него по формуле (6) - добротность.

#### Результаты

Для того, чтобы было удобно сравнить результаты, они оформлены в виде таблицы 4.

# Вывод

Были исследованы свободные колебания в контуре, и разными методами получены ответы на поставленные вопросы. Теперь можно сравнить их и дать характеристику разным методам. Для измерения  $R_{\rm кр}$  лучше использовать метод графика с использованием декремента затухаания. Так будут получены более точные результаты. Проблемы расчета с помощью формулы (4) в том, что L и R зависят от частоты контура, что создает дополнительную погрешность, так как в работе индуктивность и сопротивление катушки измеряны при другой частоте, чем возникает в контуре с используемой емкостью. Подбором можно получить лишь качественную оценку критического сопротивления, однако по близости к нему можно определить достоверность остальных результатов, так как при этом сопротивлении ясно виден перееход колебаний в апериодичный режим.

Расчет добротности через параметры установки имеет ту же проблему, но с учетом погрешности согласуются со значениями, полученными методом спирали - самым точным методом. Его точность выше, потому что можно точнее определить деркемент затухания.